



	DIN V VDE V 0126-18-4-2 (VDE V 0126-18-4-2)	
	<p>Dies ist zugleich eine VDE-Vornorm im Sinne von VDE 0022. Sie ist unter der oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der „etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.</p>	

ICS 27.160

Vornorm

**Solarscheiben –
Teil 4-2: Verfahren zur Messung der elektrischen Eigenschaften von
Siliciumscheiben –
Minoritätsladungsträgerlebensdauer, Labor-Messmethode**

Solar wafers –
Part 4-2: Process for measuring the electrical characteristics of silicon –
Minority carrier lifetime, Laboratory measuring method

Poules solaires –
Partie 4-2: Mesures des caractéristiques électriques des poules de silicium –
Durée de vie effective des porteurs minoritaires, méthode de mesure en laboratoire

Gesamtumfang 6 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

– Vornorm –

DIN V VDE V 0126-18-4-2 (VDE V 0126-18-4-2):2007-06

Inhalt

	Seite
Vorwort.....	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen.....	4
3 Begriffe.....	4
4 Bestimmung der Ladungsträgerlebensdauer	4
4.1 Allgemeines	4
4.2 Probenpräparation	4
4.3 Messparameter	5
5 Auswertung.....	5
6 Prüfbericht.....	6
 Bild 1 – Messbereich der Siliciumscheibe.....	 5